

Аналоговое функциональное тестирование

Модуль Analogue IC Test Solution (AICT) оснащен 24-мя каналами и способен подавать аналоговые сигналы на плату и измерять отклик (как напряжения, так и тока) тестируемого устройства. Эти же каналы могут быть настроены на ограничение выходного напряжения до заданного уровня для защиты компонентов платы и повышения гибкости тестирования устройства. Наличие этих функций в модуле SYSTEM 8 Analogue IC Tester позволяет тестировать аналоговые микросхемы на плате функционально, просто присоединив зажим к ее корпусу.

Аналоговые компоненты



Дискретные компоненты

Тестирование дискретных компонентов не составит труда благодаря трем выделенным каналам модуля. При этом возможно регулировать подаваемые и измеряемые ток и напряжения в широких пределах. Количество типов компонентов, которых можно протестировать простираются от мощных транзисторов до транзисторов Дарлингтона с высоким коэффициентом усиления.



Внутрисхемно

24-канальное матричное тестирование аналоговых сигнатур

Матричное тестирование сигнатур - это мощный инструмент, расширяющий возможности тестирования аналоговых компонентов. Матричное тестирование обеспечивает регистрацию вольт-амперных сигнатур компонента, прикладывая сигнал между каждой пары его выводов. Этим методом также можно протестировать компонент внеплатно, а также выявлять замыкания между выводами, которые затруднительно обнаружить иными методами.



Требуется ПК

Модуль SYSTEM 8 Analogue IC Tester может использоваться для эффективной диагностики неисправностей на аналоговых платах от системного до компонентного уровня, либо для функционального тестирования микросхем. Ни один другой продукт на рынке по такой низкой цене не обеспечивает сопоставимого уровня покрытия неисправностей компонентов на плате.



- Аналоговое функциональное тестирование
- Простые результаты - "прошел"/ "не прошел"
- Не требуется знания принципиальной схемы платы
- 24 аналоговых канала
- Диагностика методом сравнения плат
- Автоматическое сравнение с сохраненными данными
- Матричное тестирование сигнатур
- Автоматическое позиционирование зажима

Модуль SYSTEM 8 Analogue IC Tester (AICT)

Благодаря комбинации тестов требующих и не требующих подачу питания на плату, модуль Analogue IC Tester является идеальным решением для внутрисхемного поиска неисправностей.



www.abielectronics.co.uk

24-канальный модуль Analogue IC Tester

Анализ сигнатур

Количество каналов:	24 + 2 дискретных и опорные
Тестовое напряжение:	от 2 В до 50 В (пик-пик)
Разрешение по напряжению:	от 8 до 12 бит
Тестовая частота:	от 37.5 Гц до 12 кГц
Тестовый ток:	от 1 мкА до 150 мА
Импеданс источника:	от 100 Ом до 1 МОм
Формы сигнала:	Синус, треугольный, пилообразный
Типы графиков:	V-I, V-T, I-T
Отображение графиков:	Несколько графиков с единым масштабированием
Сравнение графиков:	Автоматический алгоритм сравнения с эталонной платой в реальном времени или из памяти
Допуск при сравнении V-I:	от 50 мВ до 500 мВ с разрешением 50 мВ
Поддержка корпусов м/с:	DIL, SOIC, PLCC, QFP и других с использованием пробника MultiProbes
Импульсные выходы:	Положительные, отрицательные или биполярные (для тиристоров / симисторов)
Амплитуда импульса	Настраиваемая, до +/-10 В
Калибровка:	Может осуществляться пользователем

Аналоговое функциональное тестирование

Количество каналов:	24 независимых + 3 дискретных
Выходное напряжение:	от -12 В до +12 В
Разрешение по напряжению:	10 бит
Выходной ток:	200 мА максимум
Режимы:	Источник напряжения, источник тока, выкл
Ток дискретного вывода:	от 10 мкА до 150 мА
Импеданс источника:	34 Ом (34 Ом, 1 кОм или 10 кОм для дискретных каналов)
Входное напряжение:	+/- 24 В
Защита от перенапряжения:	+/- 50 В
Входной импеданс:	2 МОм
Разрешение по входу:	12 бит
Ограниченное напряжения:	-10 В до +10 В
Разрешение ограниченного напряжения:	8 бит
Измерение тока:	от 1 мА до 150 мА (от 10 нА до 150 мА для дискретных каналов)
Разрешение измерения тока:	12 бит
Входной импеданс измерителя тока:	50 Ом (50 Ом, 1 кОм, 10 кОм или 1 МОм для дискретных каналов)
Порог детектирования замыкания:	<4 Ом
Порог детектирования связи:	<10 Ом
Режимы тестирования:	Одиночный, б.езконечный цикл, цикл "годен", цикл "не годен"
Позиционирование зажимов:	Автоматически настраиваемая ориентация зажимов
Компенсация влияния схемы:	Автоматически перестраивает программу тестирования для микросхем и соединителей на плате
Графики тестирования:	Индикация тестовых сигналов и напряжений
Анализ:	Отображение тестовых параметров, таких как коэффициент усиления, hfe, коэффициент обратной связи
Типы тестируемых микросхем:	Операционные усилители, компараторы, ЦАП, АЦП, коммутаторы и специализированные аналоговые микросхемы (внутрисхемно)
Типы тестируемых дискретных компонентов:	Биполярные и полевые транзисторы, тиристоры, симисторы внутри- или внесхемно
Тестовые библиотеки м/схем:	Аналоговые, дискретные, корпуса, пользовательские
Сравнение результатов:	Результаты могут быть сохранены для последующего сравнения
Поддерживаемые корпуса:	DIL, SOIC, PLCC и другие с использованием пробника MultiProbe
Программирование:	Программный язык для пополнения библиотеки

Другие параметры

Electrical input:	(тип.) +12 В, 1 А (макс.) (тип.) -5 В, 750 мА (тип.) -12 В, 100 мА
Габариты:	147 x 202 x 42 мм
Масса:	1 кг

Комплект поставки

Стандартно	1 x пинцет для SMD-компонентов и адаптеры 1 x 24-канальный тестовый зажим с кабельной сборкой 1 x голубой В-А пробник и адаптер 1 x желтый В-А пробник и адаптер 2 x провода для имп. выходов 2 x провода заземления 3 x дискретных пробника
Опции	Интерфейс PCI Корпус MultiLink (платная опция) с шиной USB. Внешний корпус (платная опция), включающий до 5-ти модулей SYSTEM 8 (и интерфейс USB).

Компания ABI продолжает совершенствовать свою продукцию для повышения качества. Таким образом, реальные характеристики модулей могут отличаться от описанных в этом документе.



ООО "ЭлекТрейд-М" - официальный партнер ABI Electronics
Тел./Факс: +7 (495) 800-2360
E-mail: info@eltn.ru
www.eltn.ru

